

Syringe Sampling System

with LiQuilaz® II Particle Counter

Ideal for applications where precise, small-volume sampling is needed.

Without measurement there is no control

LiQuilaz® II パーティクルカウンタを搭載した、シリンジサンプリングシステム “SLS-シリーズ” は、液中に含まれる不溶性微粒子の測定に用いられ、少量のサンプル量で正確なバッチ サンプリング アプリケーションを提供いたします。

計測効率は100%であり、吸引したサンプル全てを測定します。本装置は、広範囲なバッチ サンプリング アプリケーションに、ご利用いただけます。

利点

優れた費用対効果

- 少量サンプリングが可能のため、高額製品のサンプリング量を最小限に抑えることが可能
- 操作はWindowsベースのソフトウェアであり、オペレータの作業負担を最小限に抑える事が可能
- 広範囲な測定サンプルに対応

使いやすさ

- サンプルごとにレシピを作成することが可能
- 複数のオペレータがサンプルを測定してもレシピにより、同じ測定条件を選択可能
- ユーザーレベルの設定が可能
- セキュリティパスワードの設定可能
- 最大15種類の粒子径チャンネルを設定可能

アプリケーション

- 化学薬品の品質管理
- 部品洗浄度試験
- 研究室内での、超純水および薬液試験



**PARTICLE
MEASURING
SYSTEMS®**

a spectris company

Syringe Sampling System

with LiQuilaz® II Particle Counter

Specifications

製品名	SLS-2000	SLS-2000	SLS-1200	SLS-1300	SLS-1500
搭載センサー名	LiQuilaz II E15P	LiQuilaz II E20P	LiQuilaz II S02	LiQuilaz II S03	LiQuilaz II S05
粒径チャンネル範囲	1.5 – 125 µm	2.0 – 125.0 µm	0.2 – 2.0 µm	0.3 – 3.0 µm	0.5 – 20.0 µm
最大チャンネル数	15				
流量 (ml/min)	20 ml/min				
計測効率	100%				
最大可測粒子濃度*	10,000 個/ml				
偽計数	< 50 個/L				
サンプル温度範囲	10 – 50 °C				
接液面材料	Fused Silica, Black Quartz, Teflon, Kel-F®, Kalrez®		Sapphire, Teflon, Kel-F, Kalrez		
校正	使用材質は米国標準技術局(NIST : National Institute for Standards and Technology)および日本工業規格(JIS : Japanese Industrial Standards)に準拠したトレーサビリティを有します。				
操作ソフトウェア	SamplerSight				

SLS-1000

シリンジサイズ	1, 5, 10 (標準), 25 ml
サンプリングモード	吸引
最小サンプル量	0.4 ml @ 20 ml/min (1mlシリンジ使用時)
接液面材料	Glass, Teflon® (総フッ素樹脂対応はオプションです)
電源	100 – 240 V, 50 – 60Hz, 1.6A
サンプル測定量	レシピにより設定
最大入力圧力	25 psi
寸法 (l, w, h)	38.1 x 22.0 x 43.4 cm
重量	13.6 kg
設置環境	温度 : 10 – 30 °C 湿度 : 結露なきこと

*計数損失が10%未満発生する粒子濃度

PMS Japan

PMS日本支社

(スペクトリス株式会社 PMS事業部)

〒210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル4F

Tel: 044 589 3498

Fax: 044 245 5000

Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター (校正・修理)

Tel: 044 589 3418

Email: SVCpmsjapan@pmeasuring.com

www.pmeasuring.com/jp/



**PARTICLE
MEASURING
SYSTEMS®**
a spectris company

LiQuilaz® is a registered trademark of Particle Measuring Systems, Inc. Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company, FC, LLC. Kalrez® is a registered trademark of DuPont. Kel-F® is a registered trademark of 3M. All other trademarks are the property of their respective owners. Particle Measuring Systems, Inc. reserves the right to change specifications without notice. © 2019 Particle Measuring Systems, Inc. All rights reserved.